PCT

## 国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

| REC'D | 15 | 5 JUL | 2004 |  |  |
|-------|----|-------|------|--|--|
| WIPO  |    |       | PCT  |  |  |

電話番号 03-3581-1101 内線 6398.

| 出願人又は代理人<br>の書類記号 NK2002-010.0   | 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/<br>IPEA/416)を参照すること。 |              |                     |           |      |  |  |
|--|---|--------------|---------------------|-----------|------|--|--|
| 国際出願番号<br>PCT/JP02/04344   | 国際出願日<br>(日.月.年) 30.04                                | . 2002       | 優先日<br>(日.月.年)      |           |      |  |  |
| 国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup> A61F9/00   |   |              |                     |           |      |  |  |
| 出願人 (氏名又は名称)<br>株式会社ニデック   | •   |              |                     | . <u></u> |      |  |  |
| 1. 国際予備審査機関が作成したこの   | 国際予備審査報告を法施行  | 規則第57条(P     | CT36条)の規定に従い        |           | る。   |  |  |
| 2. この国際予備審査報告は、この表   | 紙を含めて全部で4   | <u> </u>     | ジからなる。              |           |      |  |  |
| この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。     (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。 |   |              |                     |           |      |  |  |
| 3. この国際予備審査報告は、次の内   | 3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。                               |              |                     |           |      |  |  |
| I × 国際予備審査報告の基   | I 区 国際予備審査報告の基礎                                       |              |                     |           |      |  |  |
| π <u></u> 優先権  |   |              |                     |           |      |  |  |
| III X 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成  |   |              |                     |           |      |  |  |
| IV 開の単一性の欠如  |   |              |                     |           |      |  |  |
| V 区 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI  ある種の引用文献  |   |              |                     |           |      |  |  |
| VII 国際出願の不備  |   |              |                     |           |      |  |  |
| VII 国際出願に対する意見   |   |              |                     |           |      |  |  |
|  |   |              |                     |           |      |  |  |
|  |   | •            |                     |           |      |  |  |
| 国際予備審査の請求書を受理した日 16.10.2003  | 1   | 際予備審査報告<br>2 | を作成した日<br>5.06.2004 |           |      |  |  |
| 名称及びあて先  |   | 許庁審査官(権      | 限のある職員)             | 3 E       | 3112 |  |  |
| 日本国特許庁(IPEA/   |   | 岡崎           | 克彦                  |           |      |  |  |

東京都千代田区窟が関三丁目 4番 3 号

## 国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP02/04344

| I. 国際予備審査報告の基礎  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に<br>応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。<br>PCT規則70.16,70.17)  |  |  |  |  |  |  |  |
| × 出願時の国際出願書類  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明細書       第       ページ、出願時に提出されたもの         明細書       第       ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの         明細書       第       ページ、       付の書簡と共に提出されたもの  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請求の範囲 第項、出願時に提出されたもの請求の範囲 第項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの請求の範囲 第項、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの請求の範囲 第項、   |  |  |  |  |  |  |  |
| 図面       第       ページ/図、出願時に提出されたもの         図面       第       ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの         図面       第       ページ/図、  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明細書の配列表の部分 第  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。   |  |  |  |  |  |  |  |
| 上記の書類は、下記の言語である 語である。  □ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ この国際出願に含まれる審面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された審面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した審面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 補正により、下記の書類が削除された。       ページ         明細書 第   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認めれるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |

## 国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP02/04344

| Ⅲ. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| ・<br>1. 次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により<br>審査しない。      |  |  |  |  |  |  |
| 国際出願全体   |  |  |  |  |  |  |
| × 請求の範囲 1-6  |  |  |  |  |  |  |
| <b>理由:</b>   |  |  |  |  |  |  |
| この国際出願又は請求の範囲 1-6 は、国際予備審査をすることを要しない 次の事項を内容としている(具体的に記載すること)。               |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 明細書、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範囲 の<br>  記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 全部の請求の範囲又は請求の範囲が、明細書による十分な<br>裏付けを欠くため、見解を示すことができない。                         |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ガイドライン)に定める基準を満たしていないので、有効な国際予備審査をすることができない。                                 |  |  |  |  |  |  |
| □  |  |  |  |  |  |  |
| <b>  磁気ディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。</b>                               |  |  |  |  |  |  |

7 - 9

7 - 9

| v. | 新規性、進歩性又は産業上の利用<br>文献及び説明 | 「能性についての法第12条 | (PCT35条(2)) | に定める見解、 | それを裏付ける |
|----|---------------------------|---------------|-------------|---------|---------|
| 1. | 見解                        |               |             |         |         |
|    | •                         |               |             | ,       | •       |

進歩性(IS)

新規性(N)

請求の範囲

有

有

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲 請求の範囲

請求の範囲

請求の範囲

請求の範囲

有 無

文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1:US 5624436 A (Nidek Co., Ltd.)

1997.04.29

文献2: JP 2002-65719 A (株式会社ニデック)

2002.03.05

文献3:WO 96/04527 A1

(PHOTOELECTRON CORPORATION)

1996. 02. 15

請求の範囲7-9

文献1には、レート基準物に対して第1の光学特性を持つ曲面を形成すべく制御手段に指示する指示手段と、レート基準物に実際に形成された曲面の第2の光学特性を測定する測定手段と、第2の光学特性と第1の光学特性との比較に基づいて加工目的物に対するアブレーションレートを算出し装置の駆動情報を較正する較正手段とを備 えたアブレーション装置が記載されている。

文献3には、処置すべき人体の一部と同じ物理的寸法を有する疑似模型110が記

載されている。

上記文献1に記載された発明において、上記文献3に記載された発明を採用し、レ - ト基準物を加工目的物と同じ寸法にすることは、当業者が容易になし得ることであ

文献2には、レーザ照射の制御データを補正するために、レーザ照射後に対象物の

形状を測定する技術が記載されている。 上記文献1に記載された発明における光学特性の測定に代えて、上記文献2に記載 された形状を測定する技術を採用し、光学特性の測定を形状の測定により行う構成とすることは、当業者が容易になし得ることである。 よって、請求の範囲7-9に係る発明は、上記文献1-3により進歩性を有しな